Использование четырехзондового метода для измерения различных параметров полупроводникового материала

Samolevski, B.; Korpen, J.; Velmre, Enn XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 117 https://www.ester.ee/record=b1306141*est